Reflectivity Analysis Report
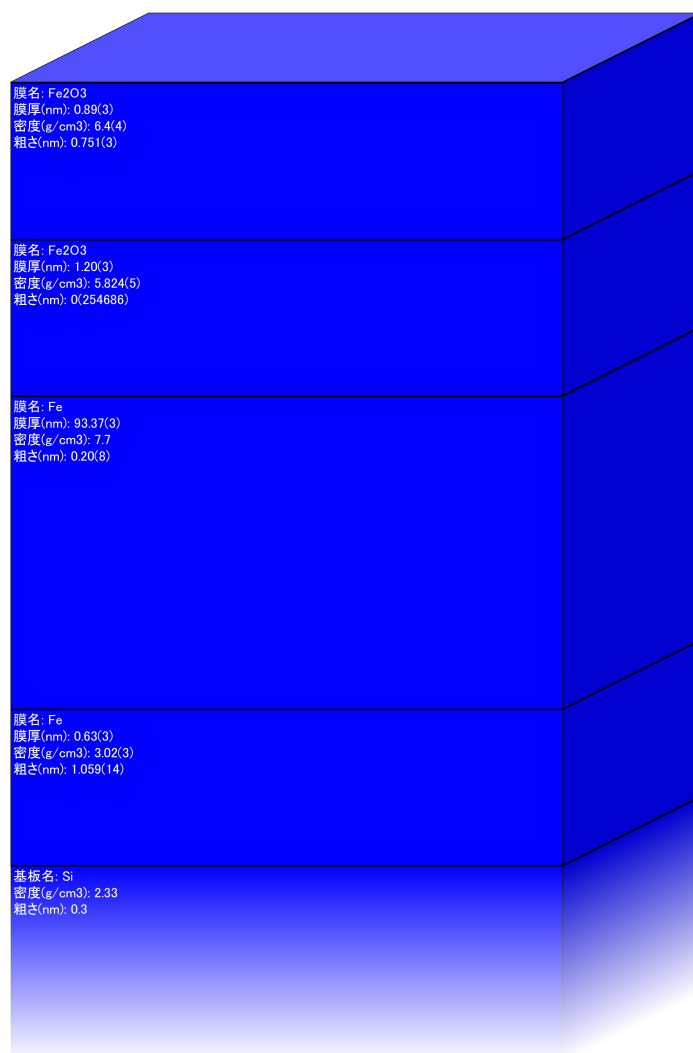
Date: March 31,2021

Sample

The multilayer structures of the following sample have been studied.

- Sample name: 2V032701 Fe20m Hirayama center1
- Measured data file: 20210331-2.ras
- Project file: 20210331-2bk.gfp

Analysis condition

- Wavelength (A): 1.540593
- Divergence (deg): 0.01
- 2-theta offset (deg): 0.0[--]
- Scale factor: 1[--]
- Background parameter: 0.00000026(5)

Results

膜名: Fe2O3
膜厚(nm): 0.89(3)
密度(g/cm3): 6.4(4)
粗さ(nm): 0.751(3)

膜名: Fe2O3
膜厚(nm): 1.20(3)
密度(g/cm3): 5.824(5)
粗さ(nm): 0(254686)

膜名: Fe
膜厚(nm): 93.37(3)
密度(g/cm3): 7.7
粗さ(nm): 0.20(8)

膜名: Fe
膜厚(nm): 0.63(3)
密度(g/cm3): 3.02(3)
粗さ(nm): 1.059(14)

基板名: Si
密度(g/cm3): 2.33
粗さ(nm): 0.3

Thickness　　　　**Density**　　　　**Roughness**

ID	Material	(nm)	(g/cm3)	(nm)
4	Fe2O3	0.89(3)	6.4(4)	0.751(3)
3	Fe2O3	1.20(3)	5.824(5)	0(254686)
2	Fe	93.37(3)	7.7[--]	0.20(8)
1	Fe	0.63(3)	3.02(3)	1.059(14)
Sub.	Si	0.0[--]	2.33[--]	0.3[--]

X線反射率プロファイル

凡例：
測定データ ———
計算データ ———
残差データ ———

X線反射強度（相対値）

残差 ／(log10（強度）)

2θ（deg）

フーリエ変換 プロファイル

相対フーリエ変換強度

深さ ／ 膜厚（nm）

密度分布